も無機は大変である。	APACE CHEROLOGICAL AND AREA
Patent Number:	JP4296692
Publication date:	1992-10-21
Inventor(s):	TADA TAKESHI OHATS 03
Applicant(s):	RIEOH COLLTÓ
Requested Patent:	☐ <u>JP4296642</u>
Application Number	JP19910062258 19910327
Priority Number(s):	
IPC Classification;	G01N21/88; G01B11/30; G01J1/02;/G01J1/04
EC Classification:	
Equivalents:	
	:Abstract
CONSTITUTION:A scomprising a polygor photo-detector 6 white electric signals. Also surface 5 into the phintroducing the laser	n a sample surface-defect detecting device capable of easily increasing the efficiency in ted from the surface of a sample sample surface-defect detecting device is provided with a laser beam scanning means in mirror 3, etc.; for scanning the surface of a sample 5 with laser beam and as chireceives the laser beam light reflected from the sample surface 5 and converts it into an integrating sphere 9 for collecting the laser beam light reflected from the sample oto-detector 6 and an optical fiber array 8 composed of multiple optical fibers and 4 beam light reflected from the sample surface 5 into the integrating sphere 9 by injecting it explical plane of incidence 8a of the optical fiber array 8 is formed of recessed annular.
	Data supplied from the esp@cenet database - I2

築光効率を高めるとともに、光ファイパからの出射光の 広がりを小さくすることができ、 積分球を小型化するこ とができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】請求項1および請求項2記載の発明に係る試料 表面欠路検出装置の一実施例を示すその全体斜視図。

【図2】図1における光ファイパの配列を説明するための概略全体図。

【図3】 請求項4 配載の発明に係る試料表面欠陥検出装置の一実施例を示すその要部側面図。

【図4】図3における変形コーンおよび積分球の斜視 図。

【図5】図3における変形コーン中の光束経路を示す図。

【図6】図3における変形コーンの作用説明図。

【図7】 請求項5 記載の発明に係る試料表面欠陥検出装置の一実施例を示す概略全体図。

【図8】図7における光ファイパの作用説明図。 【符号の説明】

- 1 レーザ光源 (レーザ光走査手段)
- 2 レンズ系 (レーザ光走査手段)
- 3 ポリゴンミラー (レーザ光走査手段)
- 4 P θ レンズ (レーザ光走査手段)
- 5 試料表面
- 6 光検出器 (光電変換手段)
- 8、21 光ファイパアレイ
- 10 8 光入射面
 - 9 積分球
 - 10、22 光ファイバ
 - 10a、22a 光ファイパの光入射面近傍部
 - 11 変形コーン
 - 11a 円形開口
 - 11 b 変形コーン状反射面

